



Title of Change:	Assembly and Test Transfer from AUK Dalian, China to JCET CHUZHOU China for T0 92 products for case outline 135AR and 135AN
Proposed First Ship date:	30 Apr 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or albert.reyes@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Product marked with datecode PM (YW) or later may be built from current factory or from JCET. On the label of box and reel, the assy location : JC will also indicate product assembled in JCET
Change Category:	Test Change, Assembly Change
Change Sub-Category(s):	Material Change, Manufacturing Site Transfer

Sites Affected:**ON Semiconductor Sites**

None

External Foundry/Subcon Sites

JCET, China

Description and Purpose:

	Before Change Description	After Change Description
Leadframe	LF TO92 3L FeAg STAMPED	LF TO92 3L CuAg STAMPED
Die Attach	DA EPOXY 8431 AG CON	Epoxy DAD-87
Mold Compound	MC KTMC3432NS	EMG200
WB	BW Cu 1.0 MIL	BW AuPdCu 1.0 MIL
Assembly Site	AUK-Dalian	JCET Chuzhou
Test Site	AUK-Dalian	JCET Chuzhou

For Device KA431AZTA-F065

	Before Change Description	After Change Description
Leadframe	LF TO92 3L FeAg STAMPED	LF TO92 3L CuAg STAMPED
Die Attach	DA EPOXY 8431 AG CON	Epoxy DAD-87
Mold Compound	MC KTMC3432NS	EMG200
Assembly Site	AUK-Dalian	JCET Chuzhou
Test Site	AUK-Dalian	JCET Chuzhou



Product marking changes are shown here.

	From	To
Product Marking Change	Line 1 : Date code Line 2 : Device name Line 3 : Device name (Non-standard)	Line 1 : Device name Line 2: Device name Line 3 : A(LYW) A: JC (JCET) L: wafer lot number YW : Assembly Start week

Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: KA431LZTA

RMS: S69034,O69646

PACKAGE: T0-92

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/Off = 2.0 min	15,000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
H3TRB	JESD22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs
AC	JESD22-A102	Ta = 121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	J-STD-002	Ta = 245°C, 5 sec	0 hr
PD	JESD22-B100B	POD, Case outline	0 hr
LI	JESD22-B105D	Lead integrity	0 hr
ED	Electrical Distribution / Characterization	Tri Temperature, Per 48A	0 hr
TR	JESD-24-3, 24-4, 24-6 as appropriate	per device specification, pre & post process change	0 hr



QV DEVICE NAME: KA431AZTA-F065

RMS: S69031, O69642

PACKAGE: TO-92

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/Off = 2.0 min	15,000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
H3TRB	JESD22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs
AC	JESD22-A102	Ta = 121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	J-STD-002	Ta = 245°C, 5 sec	0 hr
PD	JESD22-B100B	POD, Case outline	0 hr
LI	JESD22-B105D	Lead integrity	0 hr
ED	Electrical Distribution / Characterization	Tri Temperature, Per 48A	0 hr
TR	JESD-24-3, 24-4, 24-6 as appropriate	per device specification, pre & post process change	0 hr

Estimated date for qualification completion: 14 April 2021

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FAN431AZXA	KA431LZTA
KA431AZTA	KA431LZTA
KA431LZTA	KA431LZTA
LM431ACZX	KA431LZTA
LM431BCZXA	KA431LZTA
LM431BCZX	KA431LZTA
LM431BIZX	KA431LZTA
LM431ACZ	KA431LZTA
LM431AIZ	KA431LZTA
KA431AZBU	KA431LZTA
LM431CCZ	KA431LZTA

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN23678X

発行日 : 01 Dec 2020

変更件名:	ケースアウトライン 135AR および 135AN の TO-92 製品の組立ておよび検査を AUK 大連 (中国) から JCET 州 (中国) に移管	
初回出荷予定日:	30 Apr 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < albert.reyes@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	日付コードが PM (YW) 以降の製品は、現在の工場または JCET で製造されたこととなります。箱およびリールのラベルに ASSY LOC: JC と記載されている場合も、製品が JCET で組み立てられたことを示します。	
変更カテゴリ:	検査の変更, 組立の変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更, 製造拠点の移管	
影響を受ける拠点:		
外部製造工場 / 下請業者拠点:	なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: JCET, China
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	LF TO92 3L FeAg STAMPED	LF TO92 3L CuAg STAMPED
ダイ接着剤	DA EPOXY 8431 AG CON	Epoxy DAD-87
モールド・コンパウンド	MC KTM3432NS	EMG200
WB	BW Cu 1.0 MIL	BW AuPdCu 1.0 MIL
組立拠点	AUK-Dalian	JCET Chuzhou
検査拠点	AUK-Dalian	JCET Chuzhou
KA431AZTA-F065 製品用		
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	LF TO92 3L FeAg STAMPED	LF TO92 3L CuAg STAMPED
ダイ接着剤	DA EPOXY 8431 AG CON	Epoxy DAD-87
モールド・コンパウンド	MC KTM3432NS	EMG200
組立拠点	AUK-Dalian	JCET Chuzhou
検査拠点	AUK-Dalian	JCET Chuzhou



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23678X

発行日: 01 Dec 2020

製品マーキングの変更についてはこちら

	From	To
製品マーキング変更	1 行目: 日付コード 2 行目: 製品名 3 行目: 製品名 (標準品以外)	1 行目: 製品名 2 行目: 製品名 3 行目: A (LYW) A: JC (JCET) L: ウェハロット番号 YW: 組立開始週

認定計画:

デバイス名 : KA431LZTA
 RMS : S69034,O69646
 パッケージ : T0-92

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/Off = 2.0 min	15,000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
H3TRB	JESD22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs
AC	JESD22-A102	Ta = 121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	J-STD-002	Ta = 245°C, 5 sec	0 hr
PD	JESD22-B100B	POD, Case outline	0 hr
LI	JESD22-B105D	Lead integrity	0 hr
ED	Electrical Distribution / Characterization	Tri Temperature, Per48A	0 hr
TR	JESD-24-3、24-4、24-6 as appropriate	per device specification, pre & post process change	0 hr



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23678X

発行日 : 01 Dec 2020

デバイス名 : KA431AZTA-F065RMS : S69031, O69642パッケージ : T0-92

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/Off = 2.0 min	15,000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
H3TRB	JESD22 A101	Ta = 85°C, 85% RH, V=80% rated V	1008 hrs
AC	JESD22-A102	Ta = 121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	J-STD-002	Ta = 245°C, 5 sec	0 hr
PD	JESD22-B100B	POD, Case outline	0 hr
LI	JESD22-B105D	Lead integrity	0 hr
ED	Electrical Distribution / Characterization	Tri Temperature, Per48A	0 hr
TR	JESD-24-3、24-4、24-6 as appropriate	per device specification, pre & post process change	0 hr

認定完了予定日 : 14 April 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FAN431AZXA	KA431LZTA
KA431AZTA	KA431LZTA
KA431LZTA	KA431LZTA
LM431ACZX	KA431LZTA
LM431BCZXA	KA431LZTA
LM431BCZX	KA431LZTA
LM431BIZX	KA431LZTA
LM431ACZ	KA431LZTA
LM431AIZ	KA431LZTA
KA431AZBU	KA431LZTA
LM431CCZ	KA431LZTA